**Гаевский, Михаил Эрикович. Исследование тонких ВТСП пленок и структур на их основе методами низкотемпературной растровой электронной микроскопии : автореферат дис. ... кандидата физико-математических наук : 01.04.07 / Рос. академия наук. Физ.-технич. ин-т.- Санкт-Петербург, 1995.- 15 с.: ил. РГБ ОД, 9 95-4/217-4**